Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/799,786	NAKANO ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Frin D. Chiem	2883	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			,
٠			

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	I			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
Updated search - see EAST history	12/26/2006	EDC	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	:		